國立交通大學

顯示科技研究所碩士班

碩士論文

低溫複晶矽薄膜電晶體藉由直流偏壓 製造缺陷態之光漏電特性分析

ESNA

Study on the Photo Leakage Current of LTPS TFTs by Extra Defect Creation with DC Stress

研究生:李允翔 Yun-Hsiang Lee

指導教授: 戴亞翔 博士 Dr. Ya-Hsiang Tai

中華民國 九十七 年 六 月

低溫多晶矽薄膜電晶體藉由直流偏壓製造缺陷 態之光漏電特性分析

Study on the Photo Leakage Current of LTPS TFTs by Extra Defect Creation with DC stress

研究生: 李允翔 Student: Yun-Hsiang Lee

指導教授: 戴亞翔博士 Advisor: Dr. Ya-Hsiang Tai



Submitted to Department of Display Insititute
College of Electrical Engineering and Computer Science
National Chiao Tung University
in Partial Fulfillment of the Requirements
for the Degree of

Master

in

Display

June 2008

Hsinchu, Taiwan, Republic of China

中 華 民 國 九十七 年 六 月